(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-232823 (P2003-232823A)

(43)公開日 平成15年8月22日(2003.8.22)

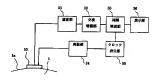
(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
G01R 29/12		G 0 1 R	29/12	D
				F
A 6 1 B 5/040	3	A 6 1 B	5/04	300B

		審查請求	有 請求項の数1 書面 (全 4 頁)		
(21)出順番号	特顧2002-73238(P2002-73238)	(71)出職人	502093689		
			中添 淳		
(22) 出顧日	平成14年2月12日(2002.2.12)		東京都稲城市東長沼1909番地		
		(71) 出源人	502093690		
特許法第30条第1項適用申請有り 2001年8月29日 社			岡▲綺▼ 油		
団法人電子情報通信学会発行の「2001年電子情報通信学			東京都三庫市下連省4丁目18番9号		
会某礎・境界ソサイエティ大会議演論文集」に発売		(72)発明者 中番 淳			
			東京都稲城市東長沼1909番娘		
		(72)発明者	日本格マ 株		
			東京都三鷹市下津省4丁目18番9号		
			Notification of the second of		

(54) [発明の名称] 電位測定案子

(57) 【要約】

【輝顕】表面電位を測定するための東子を提供する。 「解決手段】本発明の電位測定票子10においては、 体誘電体15を被測定物の表面1aに接触させ、被測定 物の表面1aの信号が印加される誘電体の誘電車を、発 部部34が発生する助振波は応じて変化させ、検出電框 11に接続された検出部の場子間に、被測定物の表面1 の表面電位が変調された交流電圧信号を発生する。こ の素子を用いて表面電位を計測する例を以下に記述す る。検出部の場子間に発生した交流電圧信号を減波部3 1、交流増幅部32を介し同期検波部33に入力し、外 2000年の影響を発生される分配 ック発生が35の助振波に同期したクロックを発生させるクロ マク発生が35の助振波に同期の表であるとしてに取扱波、増 する。この電位測定素子10を用いることにより、検測 で物と測定用電極間の接触電位差の影響を受けることとなく、被測定物の表面電位を測定することができる。



【特許請求の範囲】

(譲攻項引) 被別定物に接触した固体結構体と、 前起固体誘電体と、 前起固体誘電体により絶縁されて電極が存在する場合にはその 機比電極と、 前記検出電紙に接続された検出部と、 を有するセンサにおいて、 被測定物の信号が印加される誘電体の誘電率を催させることにより、 前記検出部の端子間に交流電圧信号を発生することを特徴とした電位計測率子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、植物や生体などを 含む導体および半導体表面の電位を測定することに関す る。

[0002]

【従来の技術】電極を被測定物に接触させて表面電位の 直流成分を検出する場合、その電極として、甘汞電極も しくは銀ー塩化銀電極が用いられる。(例えば、大熊輝 繊著「臨床脳波学」,医学書院、467頁-468頁を 参照)。

【0003】また、被測定物の表面電位の直流成分を検 出する場合、振動容量型電位センサを被測定物に押し当 てて用いることもある(特許出願公開公報「特開平8-38437号、 参照)。

【0004】センサを被測定物に接触させずに物体の表 面電位の直流成分を測定する方法として、切り込みを入 れた誘電体を被測定物と測定用電極間の空間に置き、そ の誘電体を回転させて被測定物と測定用電極間の野電管 基を変化させることにより測定用電極に誘行される電圧 を測定し、被測定物の表面電位の直流成分を非接触で知 る方法がある(特許出瞬公開公解「特開平6-3468 7号」参照)。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】物体の表面電位の直流 成分および低周波成分を測定する解、従来の電機を被測 定物に接触させると、被測定物と電極間に接触電位差が 生じ、それが測定誤差の原因となる。その接触電位差を なくすために電極面を絶縁物で覆うと、被測定物と電極 間が容量性となり、直流成分および低周波成分の計測は 難しかった。

[0006]物体の表面電位の直流成分および低周波成分を測定するために振動容量型電位センサを用いる場合、そのセンサは解析的な振動を利用するので寿命が短く、また被測定物との接触面が導体である場合は接触電位差の影響が避けられないことが予想される。また、振動部に大きな振幅の振動を与えられないため、振動部の動はよる影響を置め変化がいさく、感度が優れないという問題も予想される。また、振動容量型電位センサでは被測定地と振動部の距離そ一定にするのが難しいという問題も予想される。

[0007] また、特許出願公報「特開平6-3468

7号」の方法を生体信号計測に用いる場合は、誘電体の 回転部が存在するため安全性の面で問題が生じる場合が あることが予想される。

[0008] 本発明の目的は、これらの問題を解決し、 被測定物の表面電位の直流成分および交流成分を正確に 測定することのできる電位測定素子を提供することであ る。

[0009]

[課題を解決するための手段]上記の目的を達成するために、本発明の電位測定業子は、被測定物に接触した固 体務電体と、検出電極と、動記検出電極に接続された検 出部とを有し、前記被測定物の信号が印加される誘電体 の誘電車を変化させることにより、被測定物の信号に応 じた交流電圧信号を前記検出部の端子配に発生するよう にした。

[0010]

【実施の形態】生体表面で検出する生体信号計測に,本 発明の電位測定素子を用いる実施例を示す。

【0011】図1は本発明の電位測定素子を含む表面電位測定装置を生体信号計測に応用する一実施例の構成図である。この装置は、電位測定系10と、減速11と、交流増幅部32と、同期検波部33と、発掘部36とから構成されている。

[0012] 電空湖定業子10は、生体と接触する誘電 体と検出電極からなる変調用約電容量を有する。また、 その時電容量を助無波により変化させるための電機とし て補助電極を扱ける場合と、補助電極を設けずに映出電 植を用いてその野電容量を変化させる場合が考えら たった。 は 接続した検出部に交流電流が満れ、検出部の端子間には 生体保号管圧にした空楽電圧が発せする。

【0013】 濾波節31は、生体と検出電極間に存在する誘電体による静電容量の変化の周波数以外の周波数成 分を除去する。ただし高調波を変調信号とする場合、濾 波節31は、信号とする高調波成分以外の周波数成分を 除去する。

【0014】交流増幅部32は、濾波部31を通過した 交流電圧を増幅して、同期検波部33へ送る。

【0015】発振部34は、電位測定素子10で用いる 励振波を発生する。

【0016】クロック発生部35は、発振部34の発振 電圧に同期したクロックを発生し、同期検波部33に参 照信号を供給する。

【0017】同期検波部33は、クロック発生部35からのクロックを参照信号として、交流増幅部32の出力を同期検波し、交流信号成分を直流に変換する。

【0018】表示部36は、同期検波部33の出力を表示する。

【0019】次に、雷位測定素子10の構造および原理

を説明する。

【0020】図2と図3と図4に、電位測定素子10の 構成例を示す。

【0021】図2は補助電極を設ける場合の電位測定素 子10の一構成例である。

[0022] 電極14の表面に存在する強誘電体層11 a, 12a, 13a, 15の誘電率は強い印加電圧依存 性を有する。強誘電体層11a, 12a, 13aはつな がっていてもよい。

[0023] 検出電極11は強誘電体層11aの外側に 取り付けられた電極であり、電極14に発生する交流電 圧成分を外部出力として取り出すための電極となる。静 電容量で1は電極14、強誘電体層11a,検出電極1 1により掲載される。

【0024】電極12および電極13は補助電極であり、検出電極11と同様に強誘電体層の外側に取り付けられ、電極14との間の強誘電体層を介して生じる静電

容量C2およびC3が存在する。
【0025】電極14のもう一方の側には強誘電体層1

5が存在し、電気的な導体として作用する被測定物の表面1aに密着する。

[0026] 被測定物の表面1aの電位は接地に対して 生じるものと考えられる。また、電極14の接地に対す る電圧VSは、被測定物の表面1aの接地に対する電圧 VS ざおど電極14と被測定物1間の静電容量CSに よって発生する。

【0027】補助電極12および13には、交流励振源 の中点を接地し、接地に対して逆バイアスされた互いに 逆位相の交流電圧を印加する。電極14の接地に対する 電圧は中点と等しく、接地に対して全静電容量CT=C 2+C3を生じる。

[0028] 補助電極12および13と電極14間の静電容量で2およびで3は強誘電体用12a、13aの誘電率の印加電圧依存性により変化する。これらそれぞれの変化分を△C2、△C3とすると、静電容量ではその変化分んで=△C2+AC3を生じる。

[0029] 被測定物の表面1aの接地に対する電圧V S'による。電極14の接地に対する電圧V SはV S= {CS/(CT+CS)}・VS'となり、静電容量C Tには電荷QS=CT・VS=CT・{CS/(CT+ CS)}・VS'が蓄えられる。

 $[0\,0\,3\,0]$ 今、 Q_S が変化できない位の早さで C_2 お よび C_3 を変化させると、静電容量 ΔC_T の変化に伴い、その変化に等しい速度の端子間電圧の変化 $\Delta V_C = (\Delta C_T/C_T)$ ・ (Q_S/C_T) が電植 14 と接地間に発生する。

 $\{0031\}$ V Sによる Q Sの関係および V S による V Sの関係を用いると、 Δ V Cは V S に比例する値 Δ V C = $-(\Delta C_T/C_T)$ · $\{C_S/(C_T+C_S)\}$ V S となる。これを出力信号として増幅、検波するこ

とにより被測定物の表面 1 a の接地に対する電圧を測定することができる。

【0032】また,静電容量 C S は印加電圧依存性により,その電荷は印加電圧に対して非底線的特性を持つことから,この特性を利用して,入力信号電圧の偏移電圧に対する高調波成分の増減を出力信号とすることも可能である。

[0033] 図3は補助電極を設けない場合の電位測定 素子10の構成例であり、電極140表面に存在する強 該電体層11aおよび15の誘電率は強い印加電圧依存 性を有する。

【0034】検出電極11は強誘電体層の外側に取り付けられた電極であり、電極14に発生する交流電圧成分を外部出力として取り出すための電極となり、静電容量 C1は電極14および強誘電体層11aおよび検出電極 11により構成される。

【0035】電極14のもう一方の側には強誘電体層15が存在し、電気的な導体として作用する被測定物の表面1aに密着する。

【0036】被測定物の表面1aの電位は接地に対して 生にるものと考えられる。

【0037】検出電極11は接地に対して電圧が印加されると、被測定物の表面1aと電極14間の静電容量C Sおよび電極14と検出電極11間の静電容量C」はそれぞれ誘電率の印加電圧依存性により変化する。

[0038] 静電容量C₁と静電容量C₅の直列合成静 電容量をC₅ とおくと、被測定物の表面1aに電圧V 5が発生する場合、静電容量C₅ には電荷Q₅ =C 、 ×V 5が養えられる。

【0039】 今、QS が変化できない位の早さでCS を変化させると、その変化に伴ってCS の端子間には、CS の変化、すなわち ΔCS による電圧 V_{CS} にくる、 (ΔCS) (CS) (X_{CS}) (X_{CS}) (X_{CS}) (X_{CS})

【0040】従って V_S による Q_S 、を代入すると、 V_S に比例する値 V_C =-(ΔC_S 、/CS、)× V_S となる。

[0041] これを出力VCとして検出し、増幅、検波 することにより表面電位を測定することができ、図2の 例と同様に、静電容量CS に偏移電圧を印加し、静電 容量CS 対電荷特性が非磁能となる部分を用いれば、 高調波成分を変調出力とすることも可能である。

[0042] また、補助電極と電極14を設けない電位 測定素子100構成例 (図4) においても、図3の電位 測定素子の構成例と同様の変調作用により表面電位を検 出するアとができる。

【0043】また、本発明の範囲内で種々の変更が可能 である。例えば、静電容量の変化は温度、音波、光によって起こすことも可能である。また、検出機種11に接 続された検出部は電位検出来子10の内部に配置しなく てもよい。 [0044] また、本発明の実施例の範囲内で種々の変 更が可能である。例えば、譲波部31もしくは交流増幅 あ32を電位測定業子10と一体化することが可能であ る。また、渡波部31と交流増幅部32の順序を入れ替 えることも可能である。また、本発明の素子を複数個用 いて、被測定物の表面1aに誘導される信号を差動検出 することも可能である。

[0045]

【発明の効果】本発明は,以上説明したように構成されているので,以下に記載するような効果を奏する。

【0046】被測定物と測定用電極間の接触電位差の影響を受けることなく、被測定物の表面電位を測定することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】表面電位測定装置の接続構成図である。

【図2】本発明の電位測定素子の構成例である。

【図3】本発明の電位測定素子の構成例である。 【図4】本発明の電位測定素子の構成例である。 【符号の説明】

1 被測定物

1 a 被測定物の表面

10 電位測定素子 11 検出電極

11a, 12a, 13a, 15 強誘電体層

12, 13 補助電極

14 電極

3 1 濾波部

32 交流増幅部 33 同期検波部

3.4 発振部

35 クロック発生部 36 表示部

(図 3] (図 4] (図 4]